

Рис. 2. Рельеф поверхности покрытия тройной системы Ti-Mo-N при токах разряда $I_{Mo}/I_{Ti} = 170 A / 120 A$: а – рельеф поверхности; б – профиль сечения вдоль оси X; в – трехмерное изображение рельефа

Рисунки к статье М. В. Гольцева, Л. В. Кухаренко, В. П. Гольцева, Л. В. Баран «Применение АСМ в исследованиях морфологии поверхности композиционных ионно-плазменных покрытий и ионно-легированных материалов» (секция 1)

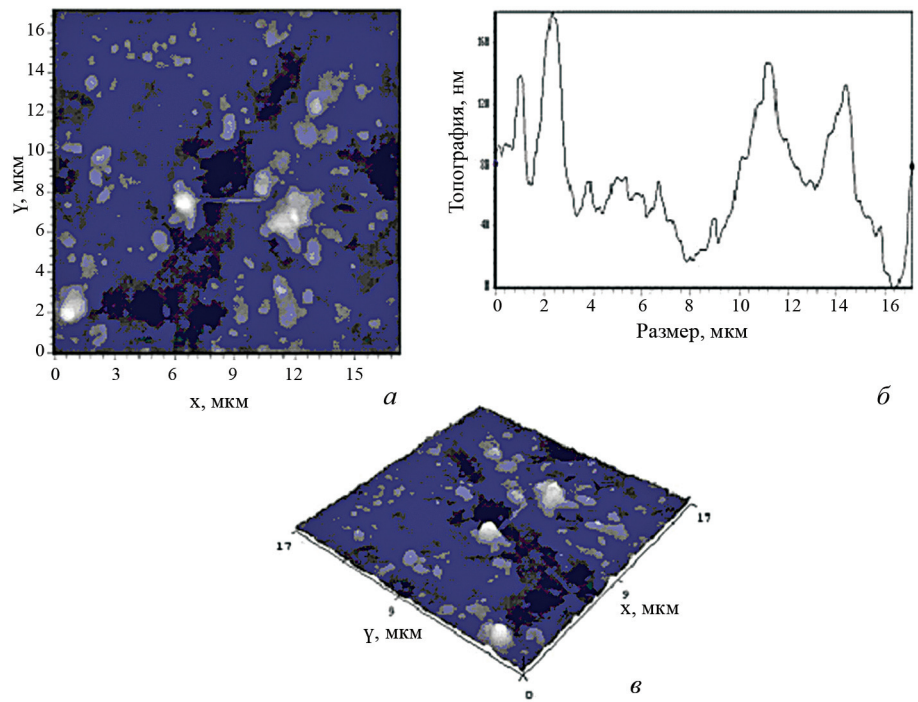


Рис. 3. Рельеф поверхности покрытия тройной системы Ti–Mo–N при токах разряда I_{Мо}/I_{Ti} = 200 А / 100 А: а – рельеф поверхности; б – профиль сечения вдоль оси X; в – трехмерное изображение рельефа

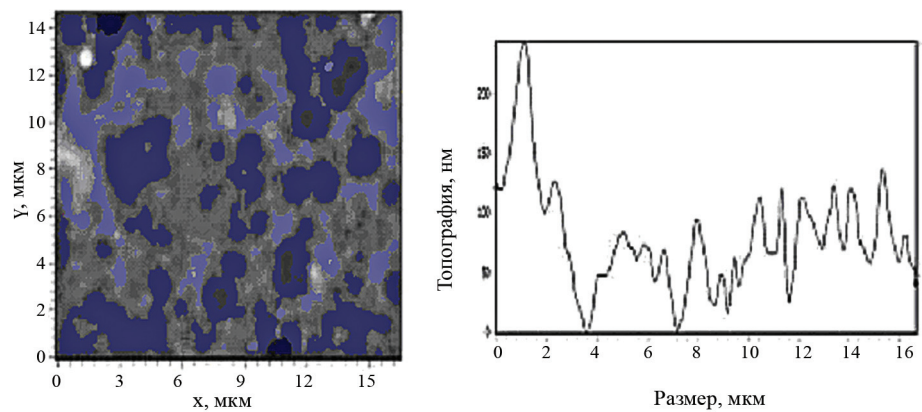


Рис. 4. Топография поверхности покрытия нитрида Ti–Zr–N, содержащего C Ti/CZr = 50/50 ат.%

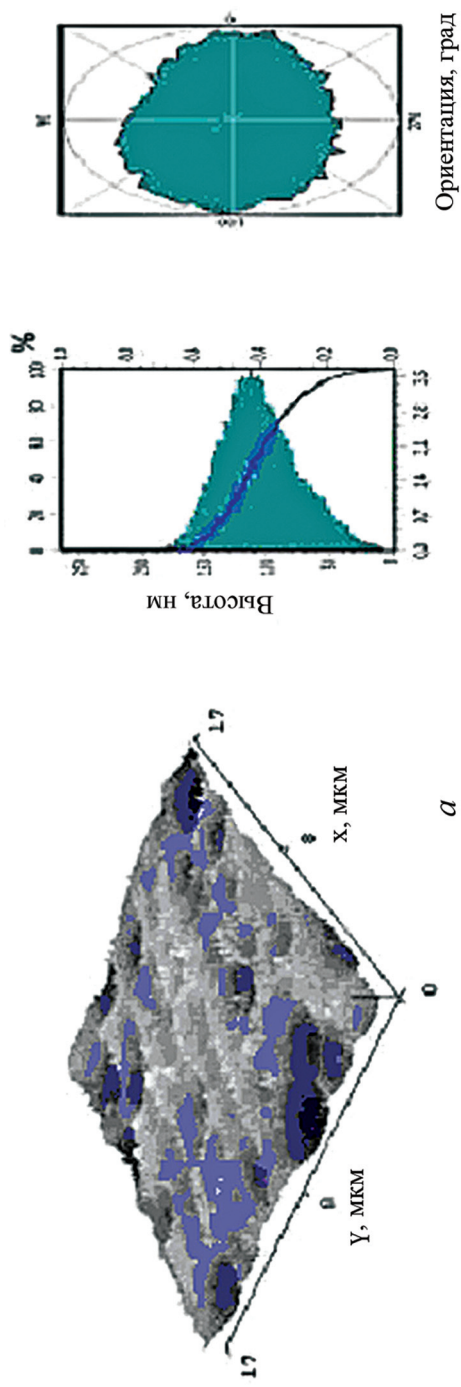


Рис. 6. Рельеф поверхности нитридного покрытия тройной системы Ti-Mo-N: а – трехмерное изображение поверхности; б – гистограмма распределения элементов структуры

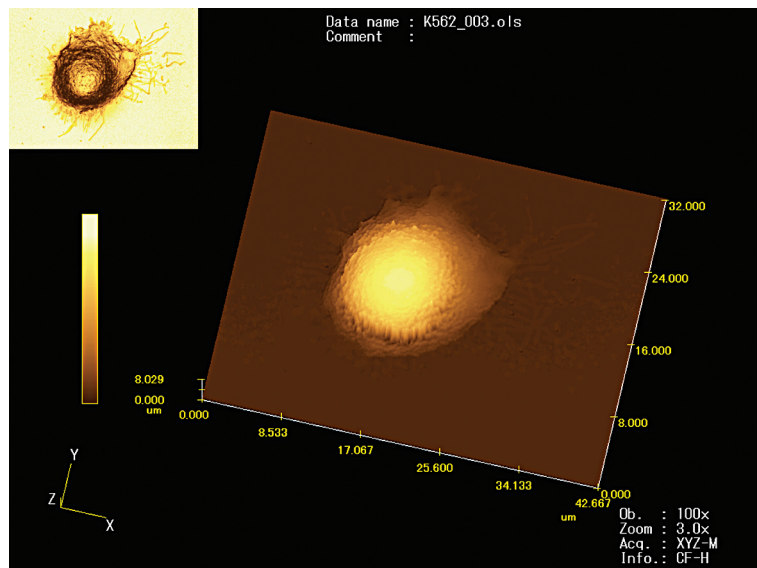


Fig. 1. Confocal laser scanning microscope image of K562 cell without etoposide treatment

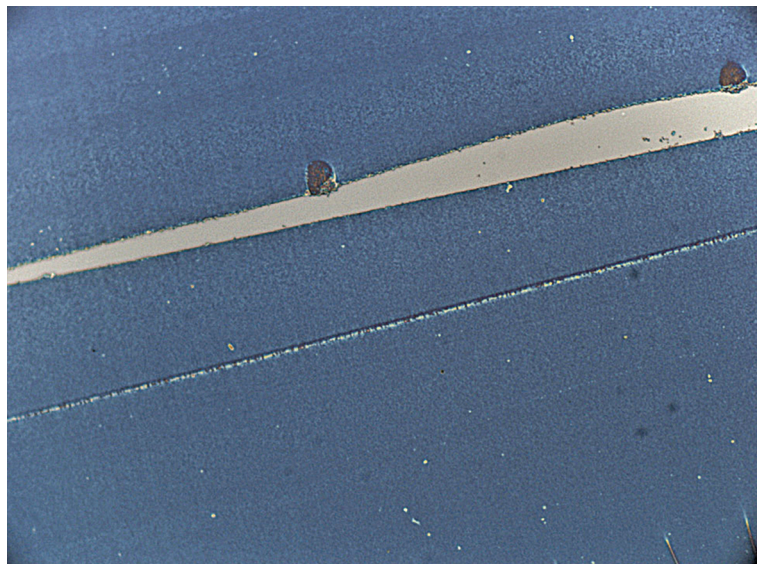


Fig. 2. Light microscopy image of ultrathin section of embedded in epoxy resin of K562 cells on Si substrate

Рисунки к статье L. V. Kukhareno, Th. Schimmel, S. Walheim, M. V. Goltseva, O. V. Aleinikova, T. V. Shman, A. A. Kukhareno «Scanning force microscopy study of k562 cells with and without etoposide treatment» (секция 1)

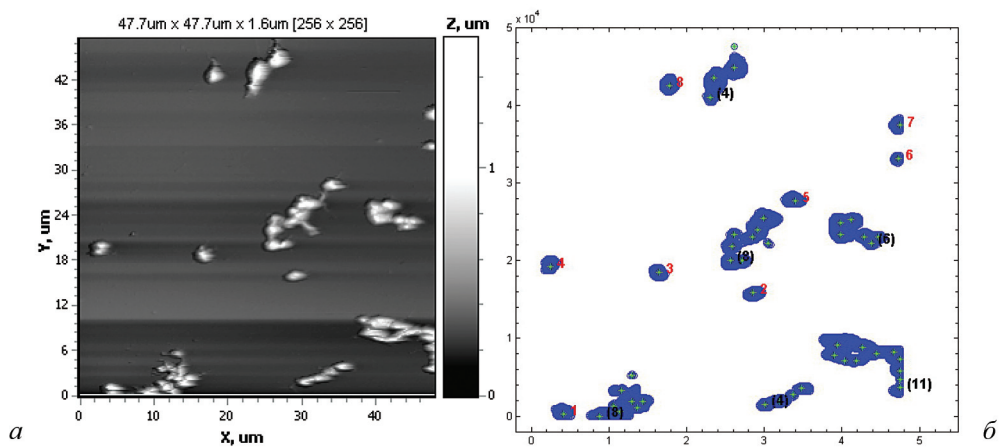


Рис. 3. 2D-изображение тромбоцитов, полученное на АСМ NT-206: *a* – исходное изображение; *б* – обработанное изображение с распознанными клетками и агрегатами

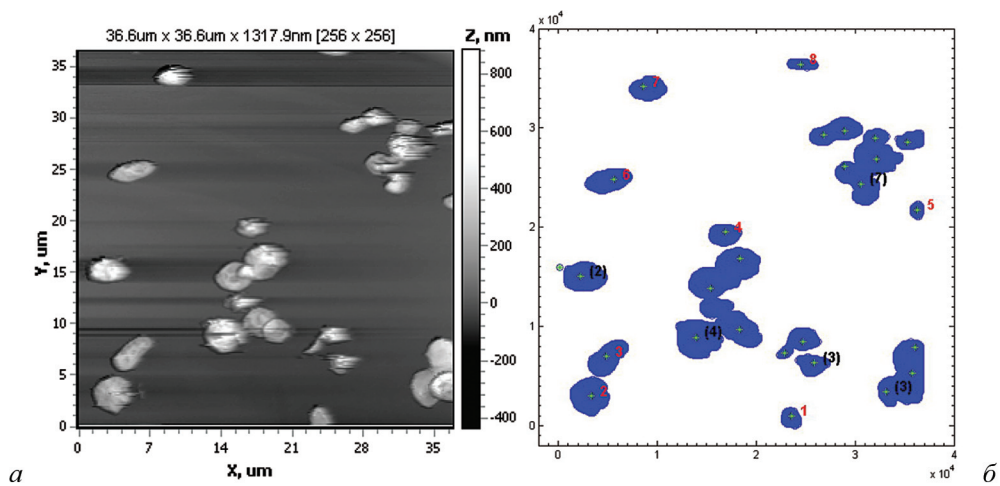


Рис. 4. 2D-изображение тромбоцитов, полученное на АСМ NT-206: *a* – исходное изображение; *б* – обработанное изображение с распознанными клетками и агрегатами

Рисунки к статье Л. В. Кухаренко, С. А. Чижика, Е. С. Дрозд, С. В. Сыроежкина, Ю. В. Селявко, Л. Г. Гелис, Е. А. Медведевой «Использование атомно-силовой микроскопии для диагностики морфофункционального состояния тромбоцитов» (секция 3)

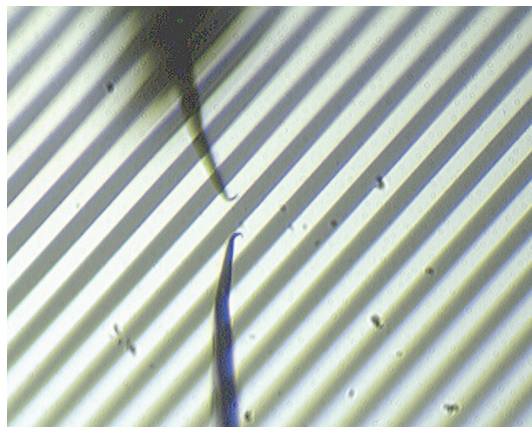


Рис. 4. Фотография зонда на основе AgClBr после контакта с поверхностью тестового образца

К статье Л. Н. Бутвиной, С. К. Секацкого, В. М. Ясинского «Ближнеполевая оптическая микроскопия инфракрасного диапазона» (секция 3)

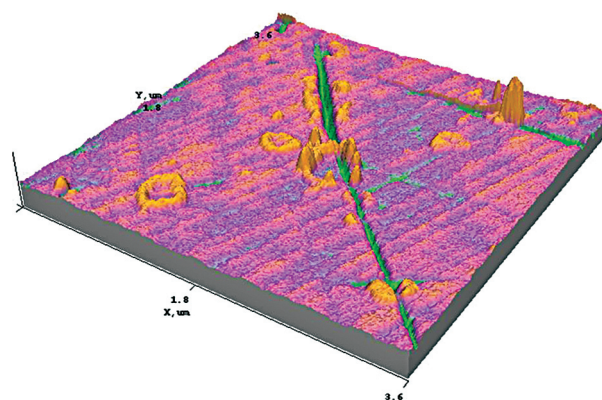


Рис. 3. АСМ-изображение поверхности образца оптического изделия при среднем увеличении

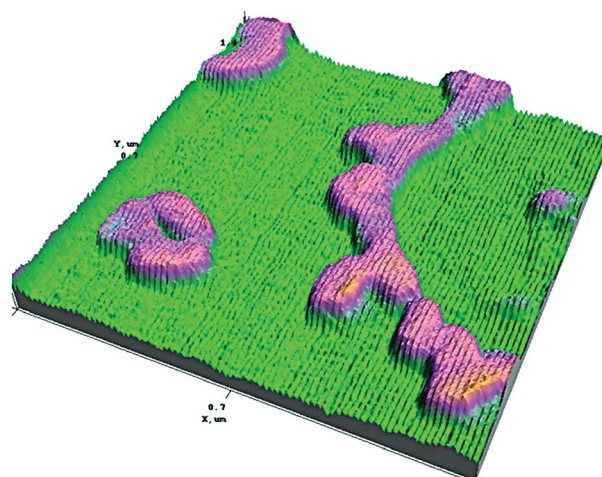


Рис. 4. АСМ-изображение поверхности образца оптического изделия при большом увеличении

Рисунки к статье М. И. Игнатовского «Зондовые методы контроля технологических параметров поверхности заготовок стекла на различных этапах обработки и изделий интегральной оптики» (секция 5)